

集成电路-低温运行试验测试-百检网

产品名称	集成电路-低温运行试验测试-百检网
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网优势：1、百检网-检测服务综合电商平台，一份报告、中国通用，省时省事省钱省心。2、汇聚众多拥有CNAS、CMA、CAL检测资质检测机构遍布中国，检测领域全行业覆盖。3、提供各种检测，认证，计量校准、电商入驻、招投标、工商抽检以及私人定制检测服务。4、报告有效、求流程自助下单，让检测变得简单。

1 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.2.4 X射线照相

2 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.2.3c) 两个或三个引出端之间电测试

3 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.2.3 b) 外壳绝缘

4 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.2.1 外部检查

5 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.4 e) 扫描电子显微技术和电子束显微分析

- 6 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 方法5003 3.2.3 a) 阈值试验
- 7 《半导体器件 机械和气候试验方法 第6部分:高温贮存》 IEC 60749-6 : 2002 高温贮存
- 8 《半导体器件 机械和气候试验方法 第9部分:标准耐久性》 IEC 60749-9 : 2002 标志耐久性
- 9 《半导体器件 机械和气候试验方法 第5部分:稳态温湿度偏置寿命验》 IEC 60749-5 : 2003 稳态温湿度偏置寿命验
- 10 《半导体器件 机械和气候试验方法 第10部分:机械冲击》 IEC 60749-10 : 2002 机械冲击
- 11 《半导体器件 机械和气候试验方法 第36部分:恒定加速度》 IEC 60749-36 : 2003 恒定加速度
- 12 《半导体器件 机械和气候试验方法 第13部分:盐气》 IEC 60749-13 : 2002 盐气
- 13 《半导体器件 机械和气候试验方法 第8部分:密封》 IEC 60749-8 : 2002 密封
- 14 《半导体器件 机械和气候试验方法 第21部分:可焊性》 IEC 60749-21 : 2004 可焊性
- 15 《半导体器件 机械和气候试验方法 第22部分:键合强度》 IEC 60749-22 : 2002 键合强度